



# 荧光定量标准片

## 荧光显微镜的性能验证、故障排除及预防维护新方案

专门为荧光成像系统的质量控制而设计。该荧光定量标准片模拟了符合显微镜的成像条件，适用于宽场、共聚焦、转盘、结构光照明等多种显微系统，用于校准、性能评估、验证和监控。具有易用、快捷、稳定（无光漂白效应）、通用等优势。

该产品由不同的二维和三维的标准荧光图案以及能够从这些图案的成像中提取显微镜相关参数的分析算法软件Daybook组成，按照是否集成光功率计可分为无光功率计的荧光定量标准片和集成光功率计的荧光定量标准片，集成光功率计的荧光定量标准片可以快速精准的实时测量系统焦平面的光功率以及辐照度。



无光功率计的荧光定量标准片



集成光功率计的荧光定量标准片

## 快速检测荧光显微镜的性能

提供场照均匀度、场畸变、分辨率等超过12项自动化质量检测，数十个相关指标。



场照均匀度



场畸变



光强响应度



线扩散函数



横向分辨率



重复定位



光谱响应度



3D重构精度



横向共定位精度



Z-Stacking期间的载物台漂移



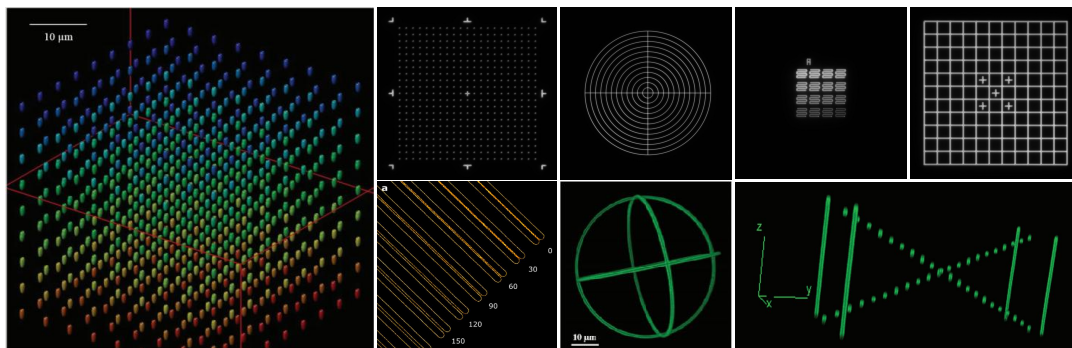
光学层析能力



光功率/辐照度

## 荧光图样以及配套Daybook软件的定量分析

荧光定量标准片中包含多种二维和三维的荧光图案，可以通过配套的Daybook软件进行定量分析。并且使用集成光功率计的荧光定量标准片可以通过该软件对光功率进行快速精准的实时检测。



软件定量分析荧光图案



软件实时监测光功率

## 规格参数

无光漂白效应，终身保持荧光效果，保修三年

尺寸：75x25x1.5毫米

激发范围：250 - 650 nm

发射范围：激发波长加上15 - 800 nm的连续光谱

浸润介质兼容性：干燥、油、水（浸水每次不超过20分钟）

光照损伤阈值：50 GW/cm<sup>2</sup>辐照度（峰值或平均值）

7天免费试用

西诺光学  
XINUO PHOTONICS



联系人：王工  
手机：18616772132（微信同号）  
电话：021-62488722-22  
邮箱：christy.wang@sinoptix.fr  
西诺光学：www.sinoptix.com.cn  
地址：上海市长宁区华山路1336号玉嘉大厦16楼D座